



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN23428XB

Issue Date:08 Oct 2020

Title of Change:	Bucheon 8inch FRD rectifiers dual source in CZ4	
Proposed First Ship date:	14 Jan 2021 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or David.Zhu@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Byeongyeop.Lee@onsemi.com	
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Affected products will be identified with date code	
Change Category:	Test Change, Wafer Fab Change	
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Addition	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
ON Semiconductor Bucheon, Korea	None	
ON Semiconductor Roznov, Czech Republic		
Description and Purpose:		
Bucheon Korea 8inch FRD rectifier dual source in CZ4 Czech Republic.		
	Before Change Description	After Change Description
Manufacturing locations for Wafer Fab and Probe Test	ON Semiconductor Bucheon, Korea	ON Semiconductor Bucheon, Korea ON Semiconductor Roznov, Czech Republic
There is no product marking change as a result of this change		

**Reliability Data Summary:**

QV1 DEVICE NAME: FGH75T65SHD-F155

RRF: 68330, 68385

PACKAGE: TO247

Test	Specification	Condition	Interval	Result
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C , 100% max rated V	1008 hrs	0/77
HAST	JESD22-A110	130°C, 85%RH, 18.8 psig, bias	96hrs	0/77
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85%RH, 18.8 psig, unbiased	96hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs	0/77
IOL	MIL STD750 (M 1037) AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C,on/off =5 min	6000 cyc	0/77
RSH	JESD22- B106	Ta=265°C, 10 sec		0/30

QV2 DEVICE NAME: FFA60UA60DN

RRF: 68327, 68386

PACKAGE: TO3P

Test	Specification	Condition	Interval	Result
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C , 80% max rated V	1008 hrs	0/77
HAST	JESD22-A110	130°C, 85%RH, 18.8 psig, bias	96hrs	0/77
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85%RH, 18.8 psig, unbiased	96hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs	0/77
IOL	MIL STD750 (M 1037) AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C,on/off =5 min	6000 cyc	0/77
RSH	JESD22- B106	Ta=265°C, 10 sec		0/30

QV3 DEVICE NAME: FFH30S60STU

RRF: 68326, 68387

PACKAGE: TO247

Test	Specification	Condition	Interval	Result
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C , 80% max rated V	1008 hrs	0/77
HAST	JESD22-A110	130°C, 85%RH, 18.8 psig, bias	96hrs	0/77
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85%RH, 18.8 psig, unbiased	96hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs	0/77
IOL	MIL STD750 (M 1037) AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C,on/off =5 min	6000 cyc	0/77
RSH	JESD22- B106	Ta=265°C, 10 sec		0/30



QV4 DEVICE NAME: RHRG75120

RRF: 68323, 68388

PACKAGE: TO247

Test	Specification	Condition	Interval	Result
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C , 80% max rated V	1008 hrs	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85%RH, 18.8 psig, bias	96hrs	0/231
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85%RH, 18.8 psig, unbiased	96hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs	0/231
IOL	MIL STD750 (M 1037) AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C,on/off =5 min	6000 cyc	0/231
RSH	JESD22- B106	Ta=265°C, 10 sec		0/90

All reliability result passed.

Electrical Characteristics Summary:

Electrical characteristics are not impacted.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
FGH40T65SPD-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH40T65UPD	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65UPD	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65UPD-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65SHDTLN4	FGH75T65SHD-F155
RHRG30120	RHRG75120
RHRP30120-F102	RHRG75120
RHRP30120	RHRG75120
RHRG75120	RHRG75120
RHRP15120	RHRG75120
FGY40T120SMD	RHRG75120
FFH75H60S	RHRG75120
RHRP1560	RHRG75120
HGTG12N60C3D	RHRG75120
RHRG1560CC	RHRG75120
RHRP1560-F102	RHRG75120



RHRP860	RHRG75120
RHRP860-F102	RHRG75120
RHRP3060	RHRG75120
HGTG20N60B3D	RHRG75120
RHRG3060	RHRG75120
RHRG3060CC	RHRG75120
RHRP3060-F102	RHRG75120
FGAF40N60SMD	RHRG75120
ISL9K3060G3	RHRG75120
ISL9R3060G2	RHRG75120
ISL9R3060P2	RHRG75120
RHRP15120-F102	RHRG75120
RHRP8120	RHRG75120
RHRP8120-F102	RHRG75120
FGH40T120SMD-F155	RHRG75120
FGH40T120SMD	RHRG75120
FFA60UA60DN	FFA60UA60DN
FFAF60UA60DN	FFA60UA60DN
FFAF30UA60S	FFA60UA60DN
FFPF30UA60S	FFA60UA60DN
FFH30S60STU	FFH30S60STU
FFP30S60STU	FFH30S60STU
FFH60UP60S	FFH30S60STU
FFH60UP60S3	FFH30S60STU
RURG8060	FFH30S60STU
FGA30N65SMD	FGH75T65SHD-F155
FGA40N65SMD	FGH75T65SHD-F155
FGA5065ADF	FGH75T65SHD-F155

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23428XB

発行日: 08 Oct 2020

変更件名:	富川に加えて CZ4 からの 8 インチ FRD レクティブアイヤのデュアルソース化		
初回出荷予定日:	14 Jan 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.		
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < David.Zhu@onsemi.com > にお問い合わせください。		
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。		
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または < Byeongyeop.Lee@onsemi.com > にお問い合わせください。		
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。 お問い合わせは、< PCN.Support@onsemi.com > 宛てにお願いします。		
変更部品の識別:	影響を受ける製品は日付コードで識別されます。		
変更カテゴリ:	検査の変更, ウェハファブの変更		
変更サブカテゴリ:	製造拠点の追加		
影響を受ける拠点:			
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:		
ON Semiconductor Bucheon, Korea	無し		
ON Semiconductor Roznov, Czech Republic			
説明および目的:	8 インチ FRD レクティブアイヤを富川 (韓国) に加えて CZ4 (チェコ共和国) からデュアルソースとします。		
	Process	変更前の表記	変更後の表記
	ウェハー工場および プローブ検査のための 製造拠点	ON Semiconductor Bucheon, Korea	ON Semiconductor Bucheon, Korea ON Semiconductor Roznov, Czech Republic
今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。			



信頼性データの要約:

デバイス名: FGH75T65SHD-F155

RMS: 68330, 68385

パッケージ: TO247

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C, 100% max rated V	1008 hrs	0/77
HAST	JESD22-A110	130°C, 85%RH, 18.8 psig, bias	96hrs	0/77
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85%RH, 18.8 psig, unbiased	96hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs	0/77
IOL	MIL STD750 (M 1037) AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C,on/off =5 min	6000 cyc	0/77
RSH	JESD22- B106	Ta=265°C, 10 sec		0/30

デバイス名: FFA60UA60DN

RMS: 68327, 68386

パッケージ: TO3P

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C, 80% max rated V	1008 hrs	0/77
HAST	JESD22-A110	130°C, 85%RH, 18.8 psig, bias	96hrs	0/77
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85%RH, 18.8 psig, unbiased	96hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs	0/77
IOL	MIL STD750 (M 1037) AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C,on/off =5 min	6000 cyc	0/77
RSH	JESD22- B106	Ta=265°C, 10 sec		0/30

デバイス名: FFH30S60STU

RMS: 68326, 68387

パッケージ: TO247

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C, 80% max rated V	1008 hrs	0/77
HAST	JESD22-A110	130°C, 85%RH, 18.8 psig, bias	96hrs	0/77
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85%RH, 18.8 psig, unbiased	96hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs	0/77
IOL	MIL STD750 (M 1037) AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C,on/off =5 min	6000 cyc	0/77
RSH	JESD22- B106	Ta=265°C, 10 sec		0/30



デバイス名: RHRG75120

RMS: 68323, 68388

パッケージ: TO247

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C , 80% max rated V	1008 hrs	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85%RH, 18.8 psig, bias	96hrs	0/231
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85%RH, 18.8 psig, unbiased	96hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs	0/231
IOL	MIL STD750 (M 1037) AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C,on/off =5 min	6000 cyc	0/231
RSH	JESD22- B106	Ta=265°C, 10 sec		0/90

すべての信頼性試験結果は合格しました。

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
RHRG30120	RHRG75120
RHRP30120-F102	RHRG75120
RHRP30120	RHRG75120
RHRG75120	RHRG75120
RHRP15120	RHRG75120
FGY40T120SMD	RHRG75120
FFH75H60S	RHRG75120
RHRP1560	RHRG75120
HGTG12N60C3D	RHRG75120
RHRG1560CC	RHRG75120
RHRP1560-F102	RHRG75120
RHRP860	RHRG75120
RHRP860-F102	RHRG75120
RHRP3060	RHRG75120
HGTG20N60B3D	RHRG75120
RHRG3060	RHRG75120



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23428XB

発行日: 08 Oct 2020

RHRG3060CC	RHRG75120
RHRP3060-F102	RHRG75120
FGAF40N60SMD	RHRG75120
ISL9K3060G3	RHRG75120
ISL9R3060G2	RHRG75120
ISL9R3060P2	RHRG75120
RHRP15120-F102	RHRG75120
RHRP8120	RHRG75120
RHRP8120-F102	RHRG75120
FGH40T120SMD-F155	RHRG75120
FGH40T120SMD	RHRG75120
FFA60UA60DN	FFA60UA60DN
FFAF60UA60DN	FFA60UA60DN
FFAF30UA60S	FFA60UA60DN
FFPF30UA60S	FFA60UA60DN
FFH30S60STU	FFH30S60STU
FFP30S60STU	FFH30S60STU
FFH60UP60S	FFH30S60STU
FFH60UP60S3	FFH30S60STU
RURG8060	FFH30S60STU
FGA30N65SMD	FGH75T65SHD-F155
FGA40N65SMD	FGH75T65SHD-F155
FGA5065ADF	FGH75T65SHD-F155
FGH40T65SPD-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH40T65UPD	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65UPD	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65UPD-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65SHDTLN4	FGH75T65SHD-F155